

曽田一雄,高浜健太,江口椋,加藤政彦, 嶋田大輝,丹羽健,草場啓治,長谷川正 名古屋大学大学院工学研究科

1. 測定実施日

2013年10月31日,11月7日,11月26-28日,12月3-5日 14時30分-18時30分(各1シフト計8シフト),BL7U 2014年3月4-5日14時30分-18時30分(各1シフト計8シフト),BL7U

2. 概要

B1型*M_xZn_{1-x}O (M = Mn, Ni, Co, Mg)*の価電子帯電子構造を光電子分光法で明らかにした。

3. 背景と研究目的

n型ワイドギャップ半導体のZnO は透明電極や発光素子、光触媒として期待される。常圧でウルツ鉱(B4)型構造をとるZnO は高圧下で岩塩(B1)型構造をとり、高圧下でB1型MgO と広い組成範囲で固溶体Mg_xZn_{1-x}Oを形成し、Mg 組成xの増加に伴ってバンド・ギャップ E_G が増大すると予想される[1]。本研究では、酸化物半導体の機能性制御[2]に資するため、MgO と同様にB1型構造を取る遷移金属酸化物MO(M = Mn, Ni, Co)と高圧下合成したバルク固溶体 $M_xZn_{1-x}O$ 試料の価電子帯電子構造を明らかにすることを目的とする。比較のため、薄膜試料に対する E_G の組成依存の報告[3]があるMg_xZn_{1-x}Oバルク試料についても測定した。

4. 実験内容

*M_xZn_{1-x}O*多結晶試料の表面をやすりがけにて清浄化し、できるだけ帯電効 果を避けるため、常温(約 300 K)で価電子帯光電子スペクトルを得た。束縛 エネルギーの原点は試料ホルダーに蒸着した金薄膜のフェルミ準位 E_Fとした。

5. 結果および考察

Fig.1に本課題で励起光子エネルギー40 eV を用いて得た価電子帯スペクト ル UPS とバンド計算で求めた状態密度 DOS を比較する。UPS は、2 次電子に よるバックグラウンドを繰り返し法[4]で差し引いた。計算では、強相関効果 およびスピンを考慮せず、組成 x に対して線形に依存すると仮定した格子定数 をもつ B1 型 M_x Zn_{1-x}O 結晶構造[2]に対して GGA-PBE 近似と wien2k コードに よる FLAPW 法[5]を用いた。DOS のエネルギー原点は伝導帯底 CBM あるいは E_F であり、比較のため、UPS を適当にシフトした。**Fig.1** では UPS および DOS のエネルギー原点位置を縦細線で示す。

 E_F 付近に d 電子の寄与がない Mg 置換系(Fig.1 (a))では、おそらく帯電に よってスペクトルが不明瞭であり、 E_G が計算では過小評価[1]されていること を除いてスペクトル形状は DOS との対応がよい。Mg_xZn_{1-x}O が n 型であるた め、 E_F が伝導帯底にあると仮定すると、UPS の立ち上がりの束縛エネルギー で E_G が評価できる。その Mg 組成 x 依存を Fig.2 に示す。Fig.2 では、MgO および ZnO に対して報告された実験値[1]を用い、薄膜の実験結果[3]と GGA-EV 近似を用いたバンド計算による結果(間接ギャップと直接ギャップ) [1]も比較した。Mg 組成 x が増加すると、計算結果同様、徐々に E_G が大きく なるが、x = 0.75 では、薄膜の値の半分程度であり、ほとんど変化しない。こ れは表面準位によるフェルミ準位のピニングや欠陥準位に起因するかもしれ ない。今後、これらの不一致の原因を検討する。

一方、Coなど開いた d 殻を持つ遷移金属酸化物との固溶体では、強相関効 果を考慮しない今回の計算結果は d バンド内に E_Fがある金属的バンド構造を 示し、Coと Mn では、バンド構造に大きな違いはない。しかし、Co_xZn_{1-x}Oの UPS には、フェルミ端が見られ、スペクトル形状は計算と対応するように見 えるが、Mn_xZn_{1-x}Oでは、ギャップが見られ、計算結果と非常に異なる。今後、 強相関効果を取り入れたモデル計算と比較するとともに、遷移金属 M3p-3d 共 鳴光電子放出を利用して M3d 部分状態密度分布を明らかにし、今回見出した 相違の原因を理解し、機能性向上の指針を得たい。



Fig.2 ギャップの Mg 組成依存.

6. 今後の課題

表面準位の影響を明らかにし、また、共鳴光電子放出によって M3d 部分状態密度分布を調べ、機能性との相関を解明する必要がある。

7. 参考文献

- [1] B. Armani et al., Comput. Mater. Sci. 40 (2007) 66.
- [2] D. K. Kanan and E. A. Karter, J. Phys. Chem. C 116 (2012) 9876.
- [3] R. Schmidt-Grund et al., AIP Conf. Proc. 772, (2005) 201.
- [4] K. Soda et al., J. Phys. Soc. Jpn. 60 (1991) 3059.
- [5] P. Blach et al., Comput. Phys. Commun. 59 (1990) 399.